

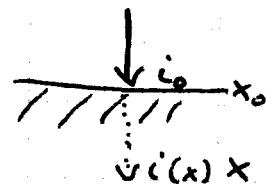
### 3.3. Generation, Recombination + Basic Equations

In  $\ddot{\text{u}}$  diesem Abschnitt werden wir die dominierenden Prozesse zur Absorption von Licht und Rekombination der erzeugten  $e^-$ -Loch-Paare kennzeichnen.

#### 3.3.1 Absorption von Licht

Da die Abschwächung eines Lichtstrahls durch Materie proportional zur jeweiligen Intensität ist:  $\frac{di}{i} = -\alpha dx$  folgt das bekannte exponentielle Abfall mit der Einheit  $(x-x_0)$  und dem Absorptionskoeffizienten  $\alpha(\omega)$ , der eine Funktion der Wellenlänge des Lichts ist:

$$i(x) = i(x_0) e^{-\alpha(\omega)[x-x_0]}$$



Die Möglichkeiten zur Absorption unterscheiden sich nun stark zwischen direktem und indirektem Bröcklichen Halbleitern:

#### Direct-Direct-Gap:

Photonen besitzen recht große Energien ( $E_\text{h}$ ) im Vergleich zu deren Impulsen. Wir sehen dies natürlich von der Relativtheorie des gewöhnlichen Materie ab. Am Ende vom Tag liegen reelle Teilchen schließlich auf der Massebahn  $k^2 = k_0^2 - \frac{p^2}{c^2} = m^2$ . {Aber zurück zu Photovoltaik...}

Impuls:  $\frac{p}{2}$

Da die Photonen im Vergleich zum Gitterimpuls keinen Impuls mitbringen bleibt bei der Absorption des Gitterimpuls erhalten. Wir wissen aus dem Kapitel 3.2, daß & nahe der Bandgrenze die Beziehungen

$$E - E_c = \frac{p^2}{2m_e^*} ; \quad E_v - E_i = \frac{p^2}{2m_e^*} \text{ gilt.}$$

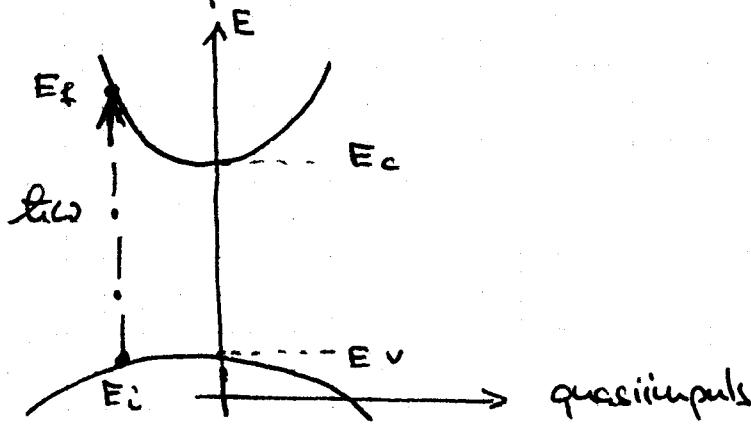
Der  $e^-$  welches ein  $\gamma$  absorbiert ist zunächst im Valenzband: ( $E_{i\text{in}} p$ ) und gelangt ins Leitungsband ( $E_{f\text{final}}$ ) wobei  $p_{\text{final}} = p_{\text{initial}} = p$  durch Impulserhaltung ( $P_f \approx 0$ ):

$$\Rightarrow E_f - E_i = \hbar\omega ; \quad E_f - E_c = \frac{p^2}{2m_e^*} ; \quad E_v - E_i = \frac{p^2}{2m_e^*}$$

$$\Rightarrow E_f - E_c + E_v - E_i = \frac{p^2}{2} \left( \frac{1}{m_e^*} + \frac{1}{m_e^*} \right)$$

$$\Rightarrow \hbar\omega - E_g = \frac{p^2}{2} \left( \frac{1}{m_e^*} + \frac{1}{m_e^*} \right)$$

D.h. mit steigender Energie des  $e^- \gamma$ 's steigt der Quasiimpuls an:



Die Wahrscheinlichkeit der Absorption hängt nun von der Zustandsdichte im Anfangs und Endzustand ab.

Für gewöhnlich steigt die Zustandsdichte mit der Energie an. Wir wissen, daß nahe des Leitungsbandrands gilt

$$N(E) \propto \sqrt{E - E_c}$$

Die meisten Zustände des  $e^{\ominus}$  ~~werden~~, welche sich noch im Valenzband befinden liegen wiederum nahe des Valenzbandrands (sie ist schließlich die höchste Energie im Valenzband). Dazu erwarten wir ein Verhalten gemäß

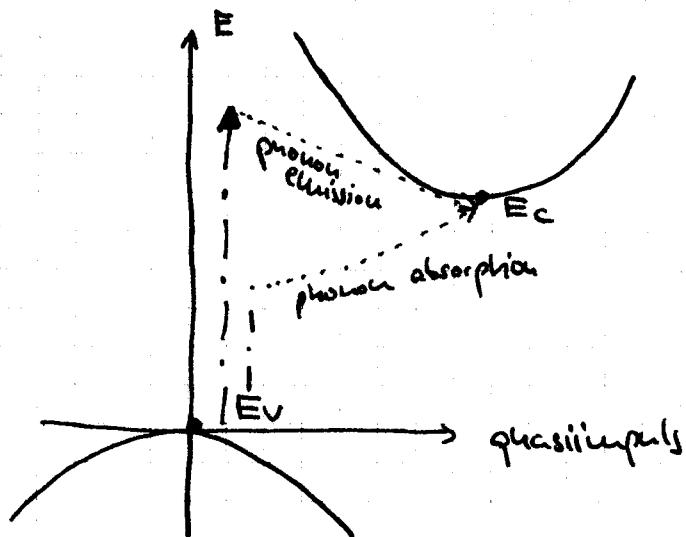
$$\begin{aligned} \alpha(\hbar\omega) &\propto N_{\text{Valenzband}}(E_V) \cdot N(E) \\ &= \text{const} \cdot \sqrt{E - E_c} \\ &= \text{const} \sqrt{E_V + \hbar\omega - E_c} \\ &= A^* \sqrt{\hbar\omega - E_g} \end{aligned}$$

Mit der Konstante  $A^* = 2 \cdot 10^4 \frac{1}{\text{cm}^2 \text{eV}}$

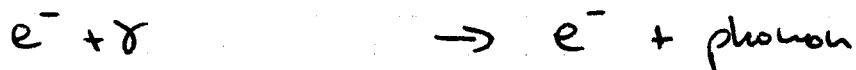
Sonnekicht wird demnach Eindringtiefen im  $[2 \cdot 10^{+4} \text{cm}^{-1}]^{-1}$  Bereich aufweisen, also  $x \approx \frac{1}{2} \cdot 10^{-4} \text{ cm} = \frac{1}{2} \cdot 10^{-4} \cdot 10^{-2} \cdot 10^6 \mu\text{m} = \frac{1}{2} \mu\text{m}$ .

### Indirect-Band-Gap

Wie wir aus Kapitel 3.2 wissen, liegt das Minimum des Leitungsbandes nicht direkt über dem Valenzband für indirekt-band-gap Halbleiter wie Silizium:



Somit muß ein  $e^-$  welches ein  $\gamma$  absorbiert noch zusätzlich mit einer Gildeanregung, einem Phonon wechselwirken. Phononen sind Prozessen. Der Prozess nicht also entweder eine Absorption oder Emission eines Phonons vor:



Die Wahrscheinlichkeit des Prozesses ist also proportional zu

$N_{e^-}(E) \cdot N_{\text{phonon}}(E) \cdot f_{\text{phonon}}$  für die Absorption, d.h.

$$\text{da } \frac{f_{\text{phonon}}}{N_{\text{phonon}}(E)} = \frac{1}{e^{\frac{E_p}{kT}} - 1} \quad \text{Bose-Einstein}$$

ist, ergibt sich

$$\text{Absorption eines phonon: } \alpha_a(\hbar\omega, E_p) = \frac{A[\hbar\omega - E_g + E_p]^2}{e^{\frac{E_p}{kT}} - 1}$$

$$\text{Emission eines phonon: } \alpha_e(\hbar\omega, E_p) = \frac{A[\hbar\omega - E_g - E_p]^2}{1 - e^{-\frac{E_p}{kT}}}$$

Da für  $\hbar\omega > E_g + E_p$  sowohl Emission als auch Absorption möglich sind, ist in dem Fall die Gesamtabsoption:

$$\alpha(\hbar\omega) = \alpha_e(\hbar\omega) + \alpha_a(\hbar\omega)$$

In der Literatur gibt es Formeln für  $\alpha(\hbar\omega)$ , die die gemessenen Kurven sehr gut beschreiben.

PPT Bis zur Wellenlänge  $> 0.4 \mu m$  sind indirekte Prozesse dominant, darüber, d.h.  $\lambda < 0.4$  gibt es einen starken Beitrag von direkten Übergängen.

### 3.3.2. Rekombination

Nach oben durch Photoem-Absorption  $e^{\ominus}$  ins Leitungsband gehoben werden, können sie natürlich wieder mit Löchern rekombinieren. Es gibt drei Hauptarten der Rekombination:

#### I. Radiative Rekombination

Ein  $e^{\ominus}$  kann unter Aussendung eines  $\gamma$ 's in einen Valenzbandzustand zurückfallen. Dies Prozess ist stark für direct-band-gap Halbleiter und schwächer für indirect-band-gap Halbleiter, da dazu hierfür ein phonon benötigt wird.

Die Gesamtrekombinationsrate für radiative Übergänge ist

$$R_R = B n p$$

Mit  $B$  als Materialkonstante,

Im Gleichgewicht ist  $u \cdot p = u_i^2$  und damit die Netto rekombinationsrate:

$$U_R = B(u_p - u_i^2)$$

Gleich welches Mechanismus, kann man die Ladungsträgerlebenszeit definieren:

$$\tau_e = \frac{\Delta n}{u}$$

$$\tau_n = \frac{\Delta p}{u}$$

$U$ : Netto Rekombinationsrate  
 $\Delta p, \Delta n$ : Störungen um die Gleichgewichtswerte  $p_0, n_0$

oder aber, da Taylor sagt:  $U = \underbrace{U(n^0, p^0)}_{=0} + \frac{\partial U}{\partial n} \Delta n + \dots +$

$$\Rightarrow \frac{1}{\tau_e} = \frac{\partial U}{\partial n} \Big|_0 ; \quad \frac{1}{\tau_n} = \frac{\partial U}{\partial p} \Big|_0$$

Für die Strahlungsübergänge dieses Abschnitts existiert da  $\Delta p = \Delta n$

$$U = 0 + \frac{\partial U}{\partial n} \Delta n + \frac{\partial U}{\partial p} \Delta p = \Delta n \left( \frac{\partial U}{\partial n} + \frac{\partial U}{\partial p} \right)$$

$$\Rightarrow \frac{dU}{dp} = \frac{du}{dn} \Big|_0 = \frac{\partial U}{\partial n} \Big|_0 + \frac{\partial U}{\partial p} \Big|_0 = B(n_0 + p_0)$$

und somit  $\frac{1}{\tau_e} = \frac{1}{\tau_n} = B(n_0 + p_0)$

Für Silizium ist  $B \approx 2 \cdot 10^{-5} \frac{\text{cm}^3}{\text{s}}$ .

Die Strahlungsrekombination ist in direct-Band-gap wesentlich stärker als in indirect band-gap.

## II Auger Rekombination

Bei der Auger - Rekombination geht ein  $e^+$  vom Leitungsband in das Valenzband über und gibt die überschüssige Energie an ein  $e^-$  im Valenz oder Leitungsband ab, welches dann Photonen aussendet. ~~Die Netto-~~ Gleichungen gibt es den Effekt mit  $1e^-$  und  $2h$ . Die Nettoeffekte sind demnach:

$$2e^-, 1h: \quad U_{\text{Aug}} = B_n (n^2 p - n_0^2 p_0)$$

$$1e^-, 2h: \quad U_{\text{Aug}} = B_p (n^2 p^2 - n_0^2 p_0^2)$$

und somit die Lebensdauer mit  $dn=dp$ :

$$2e^-, 1h: \frac{1}{2} = B_n [2n_0 p_0 + n_0^2]$$

$$1e^-, 2h: \frac{1}{2} = B_p [2n_0 p_0 + p_0^2]$$

Wegen des jeweils zweiten Terms ist die Auger - Rekombination besonders effektiv in stark dotierten Halbleitern.

Für Silizium gute Qualität ist ab einer Dotierung von  $10^{17} \text{ cm}^{-3}$  die Auger Rekombination der dominante Effekt.

## III Rekombination durch Fäden

Verschmutzungen und Störstellen führen zu zwätzlichen erkannten Zuständen in der Bandlücke. Besonders gefährlich sind dabei Zustände nahe der Mitte der Bandlücke.

### 3.3.3. Grundlegende Gleichungen

Hier leiten wir kurz die grundlegenden Gleichungen her, mit der wir dann höchstens den n-p Übergang berechnen werden. Es sind dies

#### I. Poisson Gleichung

In 3-D:  $\operatorname{div} \vec{E} = \frac{S}{\epsilon}$  und für uns in 1-d:

$$\frac{dS}{dx} = \frac{S}{\epsilon}$$

Mit

$$S = q \left( p - n + N_D^+ - N_A^- \right)$$

Und wie wir aus Kapitel 3.2 wissen gilt in guter Näherung

$$N_D^+ \approx N_D \quad ; \quad N_A^- \approx N_A$$

#### II. Stromdichte

$$J_e = q \mu_e n \{ + q \mathcal{D}_e \frac{dn}{dx} \quad ; \quad \mathcal{D}_e = \frac{kT}{q} \mu_e$$

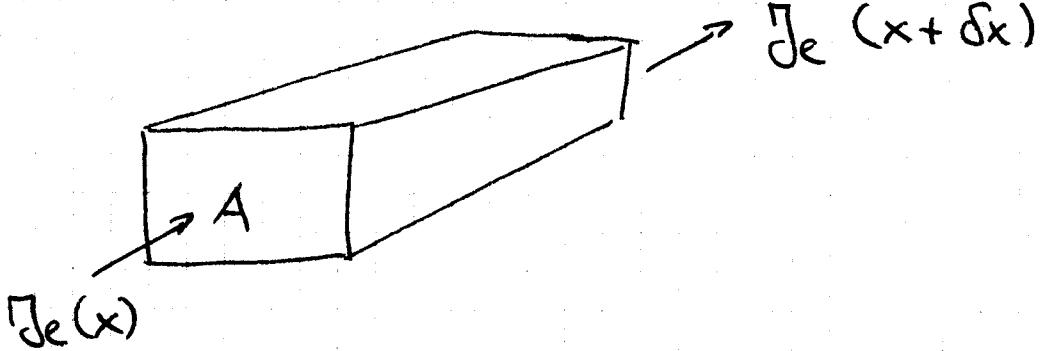
$$J_h = q \mu_h p \{ - q \mathcal{D}_h \frac{dp}{dx} \quad ; \quad \mathcal{D}_h = \frac{kT}{q} \mu_h$$

Beweglichkeit

Diffusionskonstante

#### III. Konservativitätsgleichung

Der Strom von  $n-e^-$  und Löchern kann sich nur dann ändern, wenn es zu Netto-Erezeugung oder Rekombination kommt.



Rate des eintretenden - austretenden  $e^-$  im Leitungsbereich:

$$= \frac{A}{q} \left\{ -J_e(x) + J_e(x + \delta x) \right\} = \frac{A}{q} \frac{dJ_e}{dx} \delta x$$

Das muß aber gleich sein zur Rate des Rekombination - Erzeugung:

$$= A \delta x \{ U - G \}$$

Wobei  $U$  die Nettorekombinations- und  $G$  die Nettoerzeugungsrate ist.  $G$  beinhaltet z.B. die Erzeugung von  $e^-$  im Leitungsbereich durch Lichtemission.

Ist man im Gleichgewicht, muß gelten:

$$\frac{1}{q} \frac{dJ_e}{dx} = U - G$$

Und für Löcher:

$$\frac{1}{q} \frac{dJ_h}{dx} = -(U - G)$$

Womit wir (Martin Green folgend) die grundsätzlichen Gleichungen gefunden haben, die wir reingrundsätzlich lösen müssen.

$$\frac{df}{dx} = \frac{q}{\epsilon} (p - u + v_D - v_A)$$

$$J_e = q \mu_e u \{ + q \partial_e \frac{du}{dx}$$

$$J_h = q \mu_h p \{ - q \partial_h \frac{dp}{dx}$$

$$\frac{1}{q} \frac{dJ_e}{dx} = u - g \quad ; \quad \frac{1}{q} \frac{dJ_h}{dx} = -(u - g)$$

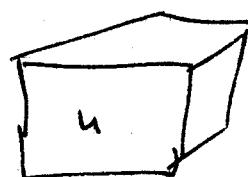
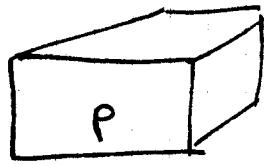
Dabei sind  $u$  und  $g$  Funktionen von  $u$  und  $p$  und im Zweifelsfall kompliziert, jedenfalls, wie wir für  $u$  geschen haben auch mit  $u^2$  etc., d.h. nicht-linearen Anteilen. Mit anderen Worten: Wir haben es mit einem System nicht-linearer, gekoppelter Differentialgleichungen zu tun. Entweder, man löst das nun numerisch, oder aber - weitans mehr erheblich - Näherungsweise.

## 3.4.: p-n Übergang Dioden

### 3.4.1 Elektrostatik des p-n Übergangs

Bringt man ein Stück p und n Halbleiter zusammen, so diffundieren die  $e^-$  aus dem Leitungsband des n-Halbleiters in den p-Halbleiter (und die Löcher von p nach n). Schließlich bildet sich ein E-Feld auf, das einer Weichen Driftstrom entgegensteht.

Diesen Gleichgewichtszustand berechnen wir im Folgenden.

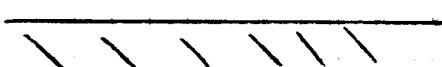
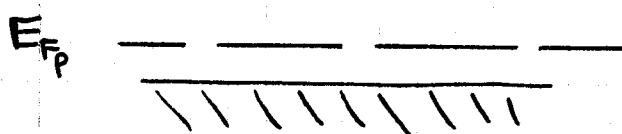
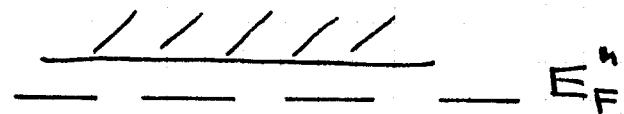


$$p = p_p^0 \approx N_A$$

$$n = n_n^0 \approx \frac{N_i^2}{N_A}$$

$$n = n_n^0 \approx N_D$$

$$p \approx \frac{N_i^2}{N_D} = p_n^0$$

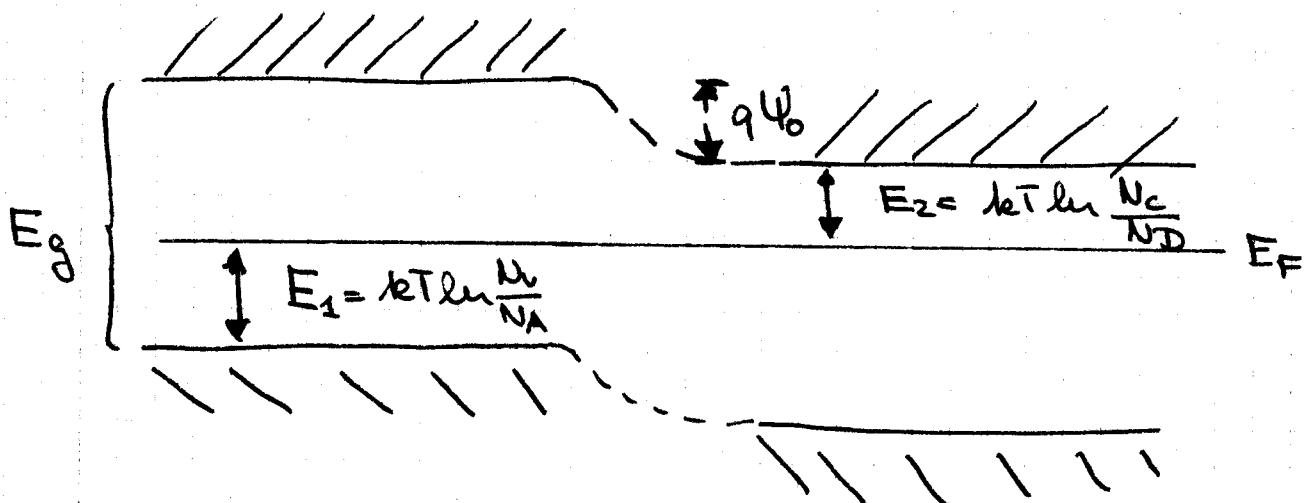
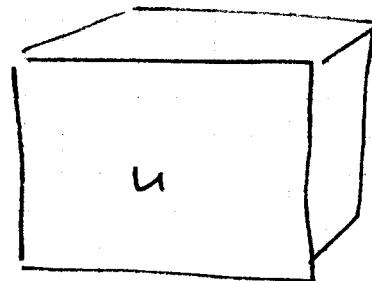
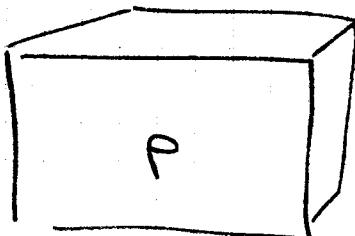

 $E_F^n$ 

Im thermischen Gleichgewicht gibt es nur ein Fermi-Niveau. Weit weg vom Übergang erwartet man, daß die Verhältnisse sind, wie im ungestörten Zustand. Mit anderen Worten: Es muß eine Potentialänderung nahe des Übergangs geben.

Erinnern wir uns an unser Ergebnisse aus 3.2, als wir die Lage des Fermi niveaus in p + n Halbleitern berechnet haben:

$$n: E_F - E_c = kT \ln \frac{N_D}{N_c} \equiv E_2$$

$$p: E_v - E_F = kT \ln \frac{N_A}{N_V} \equiv E_1$$



Somit ist der Potentialsprung gleich

$$q\Phi_0 = E_g - E_1 - E_2 = E_g - kT \ln \frac{N_c N_V}{N_A N_D}$$

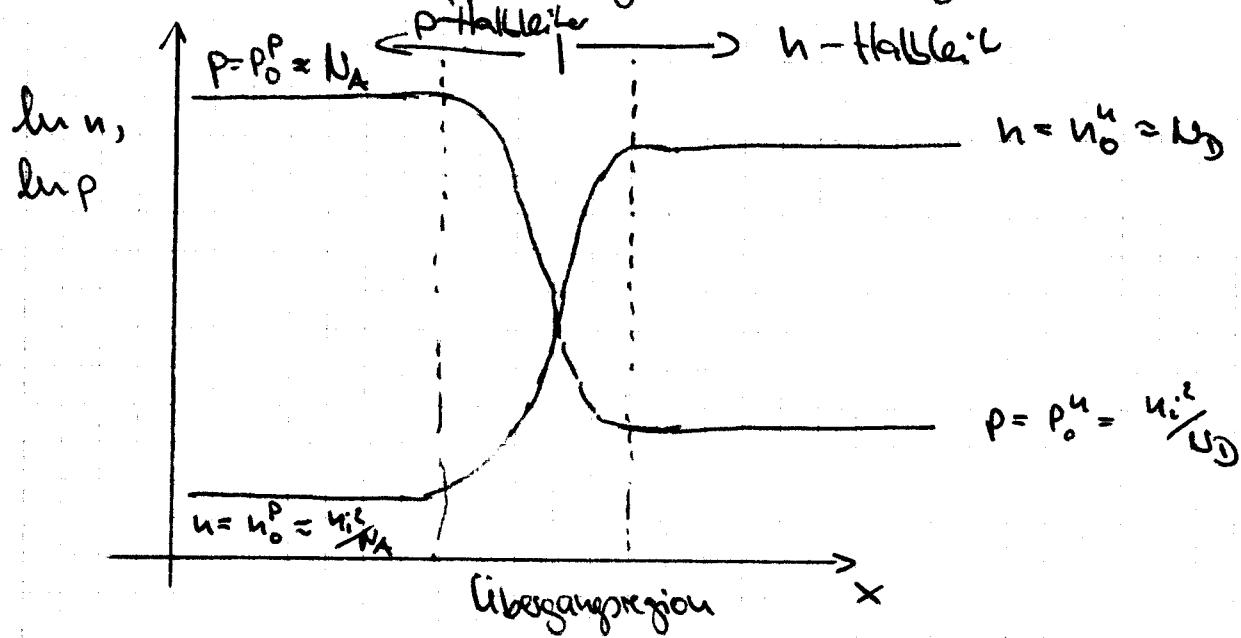
Weiterhin wissen wir aus 3.2, daß

$$n_i^2 = n_p = N_c N_V e^{-E_g/kT}$$

$$\Rightarrow \Phi_0 = \frac{kT}{q} \ln \frac{N_A N_D}{n_i^2}$$

Da die Konzentrationen von n und p, wie wir in Kapitel 3.2 gesehen haben exponentiell von

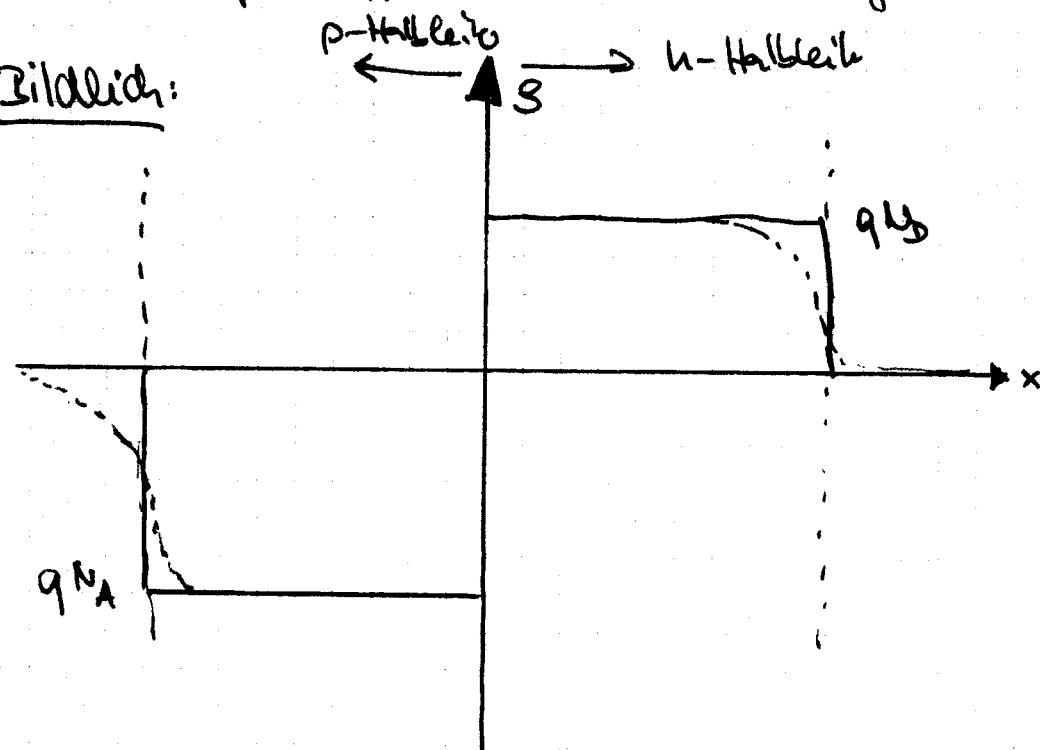
$E_F - E_C$ , bzw.  $E_V - E_F$  abhängt, ist der Übergang recht deutlich. Doppelt logarithmisch dargestellt:



In der Übergangsregion ist somit:

- Auf der n-Halbleiter Seite:  $N_D$  ionisierte Donatoren, aber  $n \ll N_D$   $e^\Theta$  im Leitungsband
- Auf der p-Halbleiter Seite:  $N_A$  ionische Akzeptoren, aber  $p \ll N_A$  Löcher in dieser Region

Bildlich:



Nochmals zum Verständnis. Weit weg vom Übergang, z. B. auf der n-Halbleiterseite ist  $p \ll n = N_D$  und deswegen  $S \approx 0$ . Im Übergangsgebiet ist  $N_D$  noch immer dasselbe (und  $N_D^+ \approx N_D$ ). Allerdings wird  $n \ll N_D$  und deswegen

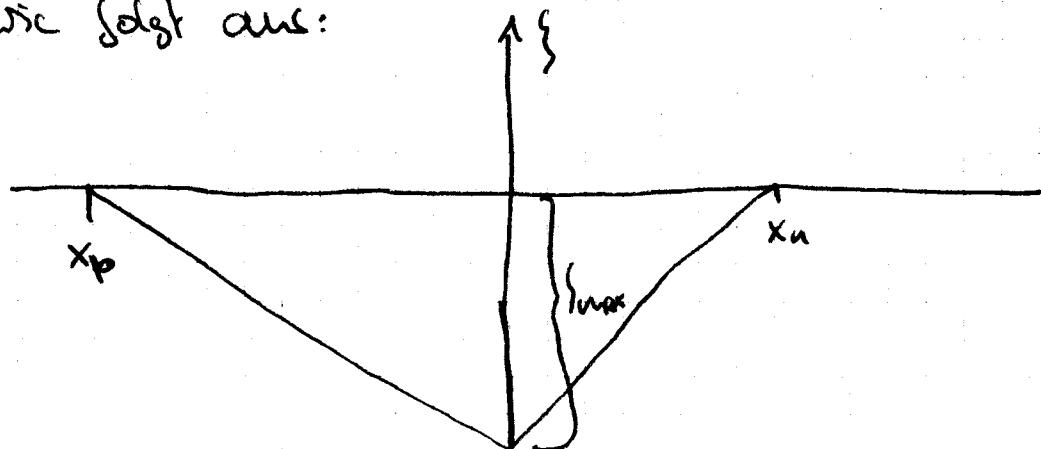
$$S = q \left( \underbrace{p - n}_{\approx 0} + \underbrace{N_D - N_A}_{\approx 0} \right) \approx q N_D$$

Zur Lösung unseres Problems machen wir die Verarmungs-Zonen Näherung: „Die p-n Diode wird in einen neutralen Bereich außerhalb des Übergangs und einen Verarmungs-Zonenbereich des Übergangs eingeteilt, in dem die Beiträge der Raumladung  $S$  von den idealischen Dotierungen herstammt“.

Das macht die Lösung recht einfach:

$$\frac{dS}{dx} = \frac{q}{\epsilon}$$

Und da wir nur im Bereich von  $x_p \dots 0$  sowie  $0 \dots x_n$  eine jeweils konstante Ladungsdichte  $S = -qN_A$ , bzw.  $S = qN_D$  haben, sieht das Feld wie folgt aus:



Die maximale Feldstärke ergibt sich zu:

$$\zeta_{\max} = \left\{ (x=0) = \int_{x_p}^0 \frac{d\zeta}{dx} dx = -\frac{q}{\epsilon} N_A (0-x_p) = \frac{q N_A}{\epsilon} x_p \right.$$

oder auch

$$-\zeta_{\max} = \int_0^{x_n} \frac{q N_D}{\epsilon} = \frac{q N_D}{\epsilon} x_n$$

somit aber auch:

$$N_D x_n = N_A x_p$$

Der Potentialsprung (genau: die Änderung)  $\Psi$  ist natürlich

$$\Psi = V(\infty) - V(-\infty)$$

$$= V(x_n) - V(x_p) \quad (\text{auf der x-Achse ist } \zeta=0)$$

$$= \text{Fläche unter } \zeta \text{ Kurve} \quad (\text{da } \frac{dV}{dx} = -\zeta)$$

$$= -\frac{1}{2} (x_n - x_p) \zeta_{\max}$$

$$= -\frac{1}{2} w \zeta_{\max}$$

$$\Rightarrow \underline{\underline{\zeta_{\max} = -2\Psi/w}}$$

Mit der Weite berechnet man aus

$$\begin{aligned} \Psi &= -\frac{1}{2} w \zeta_{\max} = \frac{1}{2} w \frac{q N_D}{\epsilon} x_n = \frac{1}{2} (x_n - x_p) \frac{q N_D}{\epsilon} x_n \\ &= \frac{1}{2} \left( x_n + \frac{N_D}{N_A} x_n \right) \frac{q N_D}{\epsilon} x_n = \frac{1}{2} x_n^2 \left[ 1 + \frac{N_D}{N_A} \right] \frac{q N_D}{\epsilon} \\ &= \frac{1}{2} x_n^2 \frac{q}{\epsilon} N_D^2 \left[ \frac{1}{N_D} + \frac{1}{N_A} \right] \end{aligned}$$

$$\Rightarrow x_n = \sqrt{2 \cdot 4 \frac{\varepsilon}{q} \left[ \frac{1}{N_D} + \frac{1}{N_A} \right]^{-1}} N_D^{-1}$$

und der  $-x_p = \frac{N_D}{N_A} x_n$  ist

$$W = x_n - x_p = x_n + \frac{N_D}{N_A} x_n = x_n \left[ \frac{1}{N_D} + \frac{1}{N_A} \right] N_D$$

$$= \underline{\underline{\sqrt{2 \cdot 4 \frac{\varepsilon}{q} \left[ \frac{1}{N_D} + \frac{1}{N_A} \right]}}}$$

Und die Anteile an den Tiefen der Verarmungszone jeweils

$$x_p = -W \frac{N_D}{N_D + N_A} ; \quad x_e = W \frac{N_A}{N_D + N_A}$$